A3

全自动测量

EMC 向单&高精度

W420×D297×H200mm

使用我公司开发的磁界探棒

即使很长的电缆也能轻松测量

对干扰源进行正交+4轴旋转*全方位检测



被工程师选择使用的EMC干扰扫描仪

High Performance EMC Noise Scaner WM7000 系列

WM7300



MORITATECH 森田テック株式会社

W M 7 3 0 0 被工程师选择使用的3个理由

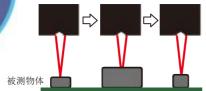
自动机械装置、软件、探棒全部由本公司自行开发!

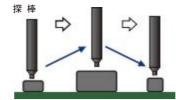
高性能 紧凑简洁

通过常年研发经验的积累, 将以高可靠性著称的自动机械装置、高分辨率视频相机和高精度的激光测距仪组合, 使高效、便捷的检测得以实现。

通过本公司自行研发的多种探棒,使符合各种用途的广频宽和高分解度的测试成为可能。

传感器





通过激光测距传感器,在不接触被测物体的前提下,对被测物体的形状进行检测。而且,通过对不同高度的被检测物体进行等距离的检测,实现对干扰物的高感知度地正确检测。



通过专门软件,使干扰信号图像化 干扰发生源一目了然

通过专门软件的使用,实现高速可靠的检测。使用操作简单的查看器软件,通过将被测物体的照片和干扰信号图的重叠,干扰发生源将一目了然。通过4画面对比模式,实现对策前后,干扰信号的差分显示。

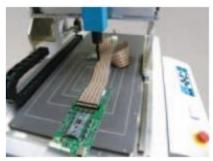
被测物体的照片和检测结果分别在左右 两侧显示。也可将被测物体的照片和干 扰信号进行重叠显示。



最大可实现A3大小物体的检测 也可进行长尺寸物体的检测

具有电路板检测用「 图像设置 」、微 小 部 件检测用「 夹 具设置」、非缆线形状的被检查物体用「点设置」等3种检测模 式,无论是谁都可以简单地完成检测。

可一次性完成对最大A3(W420×D297×H200mm) 大小的被检测物的检测。检测台内侧采用无遮蔽物的「镂空设计」,可轻松完成对常尺寸的物体进行检测。



长尺寸物体在突起的情况下也可检测

■ WM7300 规格

检测范围	W420mm×D297mm×H200mm(相机可拍摄范围)		
检测方法	付激光测距仪、近磁界扫描式探棒		
位置精度(X,Y,Z)	±0.01mm(单一方向移动的情况)		
位置精度(θ)	±1.0°		
检测频率范围	150kHz~3GHz(标准)		
最小扫描精度	0.1mm		
外观尺寸	W850mm×D770mm×H890mm(不含接口等突起部分)		
重量	约60Kg以下(仅本体、不含频谱仪和电脑)		
输入电压	AC100V~240 V		
最大消耗电力	150VA(MAX)(不含频谱仪)		

■ WM7300 适用探棒

名称	型号	公称外径	频率特性
垂直扁平0.5mm	VF005	0.5 m m	∼ 8 G H z
垂直扁平1mm	VF010	1 m m	~6GHz
垂直扁平2mm	VF020	2 m m	~3GHz
垂直扁平5mm	VF050	5 m m	~3GHz
垂直扁平10mm	VF100	1 0 m m	~2GHz
水平1mm	HC010	1 m m	~3GHz
水平2mm	HC020	2 m m	~ 2 G H z
水平5mm	HC050	5 m m	~1GHz
垂直圆形1mm	V C 0 1 0	1 m m	~3GHz
垂直圆形2mm	VC020	2 m m	~ 2 G H z
垂直圆円形5mm	VC050	5 m m	~1GHz

■制造商



森田テック株式会社

〒206-0804

東京都稲城市百村2113-4

TEL:042-401-6330 FAX:042-401-6331

e-mail: info@morita-tech.co.jp HP: www.morita-tech.co.jp

■销售代理店

1804C15-6